

TÉMATA STUDENTSKÝCH PRACÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013–14

Rámcové téma práce č. 18: XUV kontaktní mikroskopie v oblasti 300 až 500 eV

Typ práce: BP (VÚ)

Obor: FI (ON)

Vedoucí práce: doc. Ing. L. Pína, DrSc.³²

Kozultant(i):

Student:

Abstrakt: Cílem je navrhnout kontaktní XUV mikroskop se submikronovým rozlišením a provést srovnání s ostatními mikroskopickými metodami. Identifikovat vhodné aplikace.

³²<mailto:ladislav.pina@fjfi.cvut.cz>